

ナノスケール計測技術の最前線

～プローブ顕微鏡が拓く極微電子計測

Recent progress in nanoscale electron spectroscopy using SPM

2025 年 9 月 7 日 (日) 13:30 ~ 17:05

電子デバイスの発展に伴い、その計測技術もさらなる高度化が求められています。プローブ顕微鏡による局所領域での電子物性計測技術は、近年急速に発展を遂げ、空間分解能・時間分解能が飛躍的に向上するとともに、半導体を中心とする様々な材料の電子計測が実現されてきました。本シンポジウムでは、本分野の基礎研究・応用研究の最先端で活躍されている研究者を招き、また一般講演者も加えて、これまでの技術的な進展から最新の研究動向と将来展望について紹介いただきます。

招待講演 (敬称略)

菅原 康弘 (大阪大学)

「静電気力顕微鏡と光誘起力顕微鏡の最近の展開」

松本 卓也 (大阪大学)

「静電気力顕微鏡による電荷移動計測」

小林 圭 (京都大学)

「時間分解ケルビンプローブフォース顕微鏡による有機薄膜トランジスタの微視的電気特性評価」

吉田 昭二 (筑波大学)

「走査プローブ顕微鏡を用いた超高速ダイナミクス計測の最前線」

山末 耕平 (東北大学)

「時間分解走査型非線形誘電率顕微鏡が拓く半導体物性のナノスケール計測」

木村 謙介 (理化学研究所)

「テラヘルツ電場駆動トンネル電流による単一分子励起状態形成」

世話人

一井 崇 (京都大学)

大塚 洋一 (大阪大学)

西野 智昭 (東京科学大)

杉本 宜昭 (東京大学)